

SPECTROSCOPIE DE PHOTOÉLECTRONS X (XPS)

FABRICANT : Physical Electronics

MODÈLE : PHI 5600-ci spectrometer

Analyses

- Analyse de la composition de surfaces
- Profondeur étudiée : de 2 à 10 nm
- Éléments étudiés : à partir de Li

Caractéristiques

- Décapage des surfaces possible
- Analyse à angle variable
- Zone d'analyse : de 300 μm^2 à 0.8 mm^2